

# TEM基礎クラス

初心者講習 I・II のテスト合格後に受講するクラスです。基礎クラスは3つあり、最低1つのクラスを受講する必要があります。必要に応じて複数のクラスも受講可能です。JEM-2100Fにて受講した全てのクラスの履修を終えた後、JEM-2100FのBライセンス(予約権)が発行され、機器利用での単独操作が可能となります。JEM-2100のみ装置利用される方には希望する装置にて基礎クラスを受講し、ライセンスを得ていただきます。JEM-ARM200Fのみ装置利用される方については、JEM-2100Fのライセンス取得している、またはJEM-2100Fライセンス取得相当の経験者である必要があります。

ナノ粒子を観察したい。  
粒径分布を知りたい。

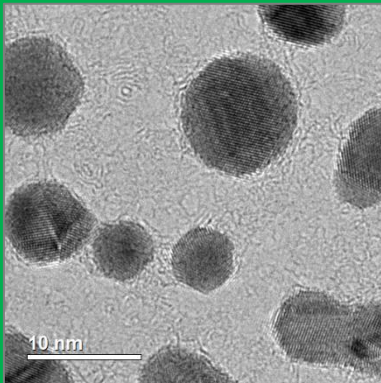
結晶粒界での原子配列  
の乱れなどを見たい。  
析出物の組成分析をし  
たい。

コアシェル粒子の観察を  
したい。  
EDSマッピングをしたい。

Selectable

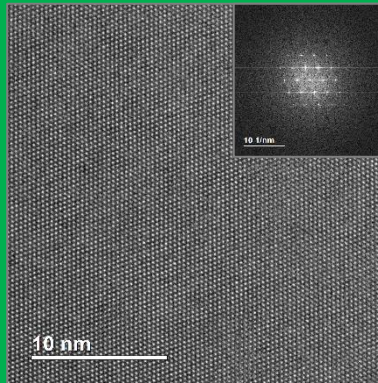
Selectable

## Nano Particle



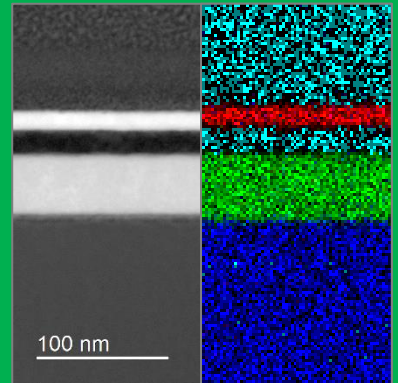
1. 技術補助
2. 標準試料または持ち込み試料
3. 内容  
TEMのアライメント(復習), 粒子サイズに適したマイクログリッドを選ぶためマイクログリッドの種類による粒子の見え方の違いを確認, ナノ粒子のHRTEM像観察時の条件設定等

## HRTEM



1. 技術補助
2. 標準試料(持ち込み試料使用不可)
3. 内容  
TEMのアライメント(復習), 結晶方位合わせ(復習), 回折図形取得(復習), HRTEM観察時の条件設定等

## STEM-EDS



1. 技術補助
2. 標準試料(持ち込み試料使用不可)
3. 内容  
STEMのアライメント  
STEM-EDSの基本操作等

↓ ↑ 不合格

↓ ↑ 不合格

↓ ↑ 不合格

実技テスト

合格 ↓

JEM-2100FまたはJEM-2100のBライセンス取得またはオプションクラス